

2021年11月24日
一般財団法人日本規格協会

JIS 見直しの審議について

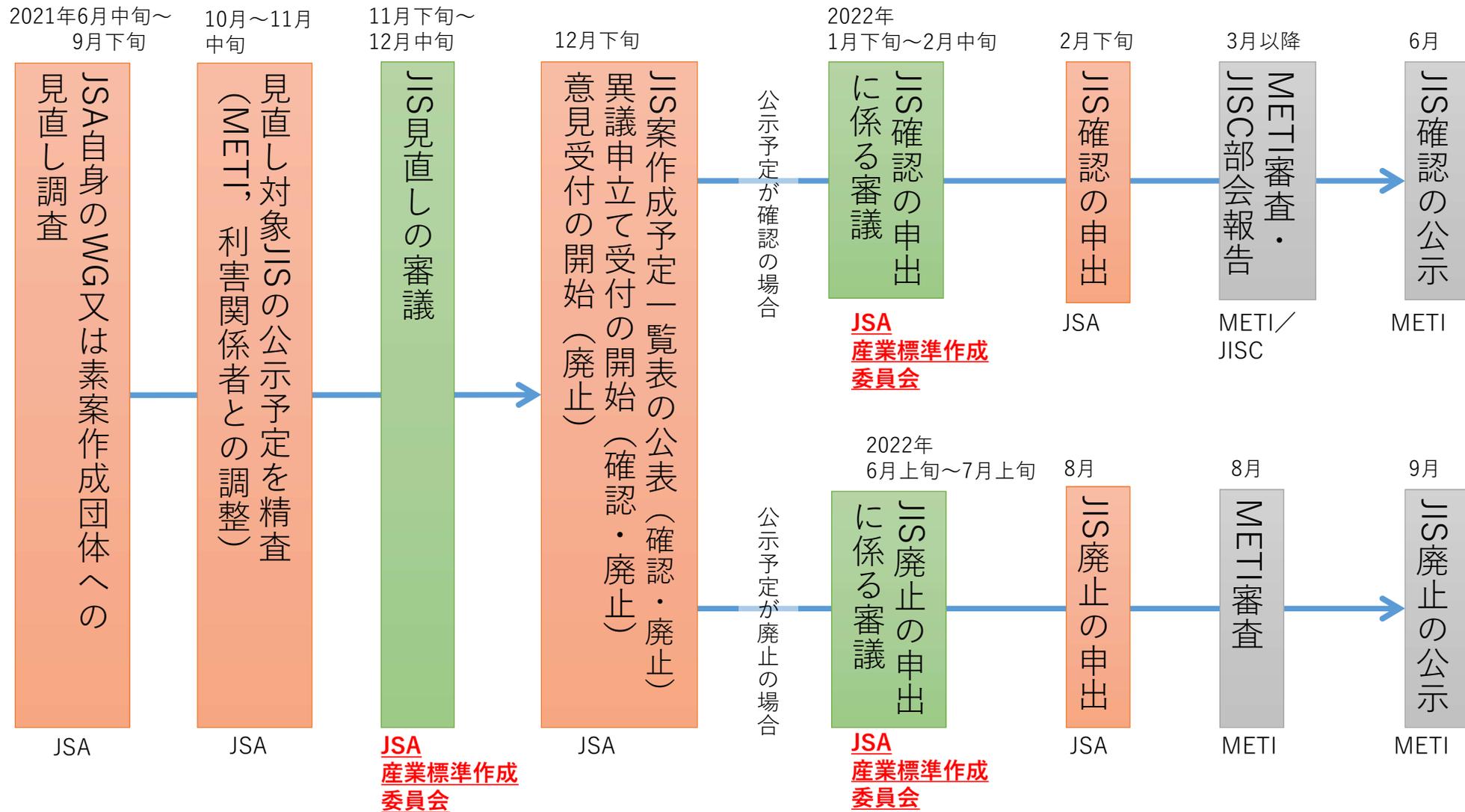
日本産業規格（以下、JIS という。）は、産業標準化法に基づき、JIS を制定又は確認若しくは改正した日から少なくとも5年を経過するまでに見直す必要があります。多数のJISがあることから効率的な運用のために、毎年度一括してJIS見直しを行うこととしております。JISの見直しの流れ及び産業標準作成委員会の審議方法は、別添1をご参照ください。今回のご審議は、別添1の“JIS見直しの審議”に該当します。

2022年度に見直し期限を迎えるJISについて、当会にて関係各方面の意見を十分に調査し、別添2のとおり2022年度中に改正、確認又は廃止とするかの案を作成いたしましたので、ご審議をお願いいたします。

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきますようお願いいたします。また、ご承認いただいたJIS見直しのうち、公示予定が「確認」、及び公示予定が「廃止」、かつ、これから廃止に着手するJISについては、その内容を利害関係者に公表するためにJIS作成予定一覧表としてJSAホームページに掲載いたします。

JISの見直しに関する審議

(1) JIS見直しの流れ



(2) JIS見直しの審議について

目的： 次年度に5年見直し期限を迎えるJISについて、「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの見直し方針を決定します。

1. 利害関係者の意見を確認するため、JSAが見直し対象のJISを抽出し、調査します。
 - ※ 見直し対象は、次年度に5年見直し期限を迎えるJISです。
 - ※ 技術的動向、対応国際規格や引用規格の改正・廃止などを背景に、JISを改正する必要があるのか、確認でよいのか、又は廃止するかなどを調査します。

(2) JIS見直しの審議について (続き)

2. JSAが調査結果に基づき、それぞれのJISについて「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの案（以下、JIS見直し案という。）を理由とともに作成します。

その際には、必要に応じて、JSA自身のWG又は素案作成団体に事実確認を行います。

その後、産業標準作成委員会にお諮りします。

- ※ 当該JISが次に該当し、次年度までに「改正」又は「廃止」の公示を予定している場合は、JIS見直し案を「改正」又は「廃止」とします。
- ※ 当該JISが次に該当し、これから改正又は廃止に着手するため、次年度までに「改正」若しくは「廃止」の公示ができない場合、又は次に該当しない場合は、JIS見直し案を「確認」とします。

改正又は廃止が必要な要因
市場実態又は技術動向に合わせ、最適な技術内容とすべく、規定内容の変更が必要
社会的要因で規定内容の変更が必要（環境問題など）
対応国際規格の改正又は廃止があり、規定内容の変更が必要
対応すべき国際規格が新たに制定され、それに整合することが必要
引用規格の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
引用すべきJISが新たに制定された
整合すべき（参照している）法規の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
整合すべき（参照している）すべき法規が新たに制定された
技術の陳腐化・利用の縮小等、JISの廃止が妥当

(2) JIS見直しの審議について (続き)

3. 産業標準作成委員会でJIS見直し案をご審議いただきます。
 - ※ JIS見直し案の資料については、JSAで事実確認を行っております。
 - ※ 対応国際規格などの改廃状況は、資料2別添2の参照文書（JSA調査結果）に記載しております。
 - ※ ご承認いただいたJIS見直しのうち、公示予定が「確認」及び「廃止」のJISは、JIS作成予定一覧表としてJSAホームページに掲載します。
(利害関係者に対する産業標準作成委員会への参加の機会の確保及び異議申立ての機会の確保のため)

(3) JIS確認の申出に係る審議

目的： 利害関係者の意向を適切に反映するためのプロセスを経て、
主務大臣にJISの確認の申出をしてよいかどうかを決定します。

1. 確認のJIS作成予定一覧表の公表によって、利害関係者の意向を確認した後、
JSAが日本産業規格作成審議経過報告書（確認）を作成します。
 - ※ 当該報告書では、確認の申出を行う対象JIS、確認する理由、認定機関としてのプロセスの結果（JIS見直しの審議～確認のJIS作成予定一覧表の公表の結果）を示しております。
2. 産業標準作成委員会で日本産業規格作成審議経過報告書（確認）に基づき、
ご審議いただきます。
 - ※ JIS見直しの審議の結果から変更がある場合は、JSAからその旨産業標準作成委員会にご報告いたします。
3. 産業標準作成委員会で承認されたJISは、JSAから主務大臣へJISの確認の申出を行います。

2022年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、廃止又は 一考入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
C5101-20	電子機器用固定コンデンサ—第20部:品種別 通則:表面実装用固定メタライズドポリエチレ ンナフレートフィルム直流通デン	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏 まえて検討する必要があるため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5101-23	電子機器用固定コンデンサ—第23部:品種別 通則:表面実装用固定メタライズドポリエチ レンナフレートフィルム直流通デン	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏 まえて検討する必要があるため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5101-23-1	電子機器用固定コンデンサ—第23-1部:ブ ランク個別規格:表面実装用固定メタライズ ドポリエチレンナフレートフィルム直流通デン サ 評価水準E2	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5101-24	電子機器用固定コンデンサ—第24部:品種別 通則:表面実装用固定タンタル固体(導電性高 分子)電解コンデンサ	確認	対応国際規格が改訂されているが、軽微な変更のた め、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5101-25	電子機器用固定コンデンサ—第25部:品種別 通則:表面実装用固定アルミニウム固体(導電 性高分子)電解コンデンサ	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度 以降となるため、確認する。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5101-26-1	電子機器用固定コンデンサ—第26-1部:ブ ランク個別規格:固定アルミニウム固体(導電 性高分子)電解コンデンサ 評価水準E2	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5101-8	電子機器用固定コンデンサ—第8部:品種別 通則:固定電解コンデンサ 種類1	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5101-9	電子機器用固定コンデンサ—第9部:品種別 通則:固定電解コンデンサ 種類2	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5160-1	電気及び電子機器用固定電気二重層コンデ ンサ—第1部:品目別通則	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏 まえて検討する必要があるため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5381-22	低圧—アーク防護デバイス—第22部:通信及び 信号伝送に接続するサーフェス防護デバイス(S PD)の選定及び適用基準	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第1部: 一般	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定である ため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-11-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11 -1部:耐熱性試験—試験11a—連耐熱性	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定である ため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-11-8	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11 -8部:耐熱性試験—試験11h—おしん	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-12-6	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12 -6部:はんだ付け試験—試験12f:自動は んだ付けにおけるフラックス及び洗浄液に対する 耐欠性	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-1-3	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第1- 3部:一般検査—試験1d:電気的寿命	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-13-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第13 -2部:機械的動作試験—試験13b:挿入力 及び引抜力	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-1-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第1- 4部:一般検査—試験1d:コンタクトの保護効 果(スクーププルーフ)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-14-7	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第14 -7部:封止(気密性)試験—試験14g:噴射	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-15-8	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第15 -8部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15 h:コンタクト保持機構、工具の使用に対する 耐欠性	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-16-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第16 -2部:コンタクト及びターミネーションの機 械的試験—試験16b:リトリクテッドエン トリ	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-16-20	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第16 -20部:コンタクト及びターミネーションの機 械的試験—試験16t:機械的強度(無はんだ接 続のターミネーション)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-16-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第16 -4部:コンタクト及びターミネーションの機 械的試験—試験16d:引張強度(圧着接続)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-16-5	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第16 -5部:コンタクト及びターミネーションの機 械的試験—試験16e:ゲージ保持力(弾性コン タクト)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-16-7	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第16 -7部:コンタクト及びターミネーションの機 械的試験—試験16g:圧着後のコンタクトの変 形測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-17-3	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第17 -3部:ケーブルクランプ試験—試験17c: ケーブルクランプ強度(ケーブルの引張り)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5402-19-3	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第19 -3部:耐化学薬品試験—試験19c:耐液性 マイクロマシン及びMEMS—第26部:マイ クロシリコン構造及びマイクロドール構造の寸 法、形状及び材料	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5630-26	マイクロマシン及びMEMS—第26部:マイ クロシリコン構造及びマイクロドール構造の寸 法、形状及び材料	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技 術産業協会
C5860	空間ビーム光用受動部品通則	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定である ため。	5: 無(提案)対応国際規格が存在せず、 国際規格に提案しないもの。		一般社団法人 光産業技術 振興協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び 西暦年	最新 公示		主務 大臣	専門 委員会	参照文書 (JSA調査結果)		
	種類	年月日			対応 国際 規格	引用 JIS	引用 国際 規格
JIS C 5101-20:2018	改正	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 5101-23:2018	改正	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 5101-23-1:2008	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 5101-24:2018	改正	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 5101-25:2018	改正	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 5101-26-1:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 5101-8:2018	改正	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 5101-9:2018	改正	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 5160-1:2018	改正	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	◎
JIS C 5381-22:2018	改正	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	◎
JIS C 5402-1:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	×	×	-
JIS C 5402-11-1:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	×	×	×
JIS C 5402-11-8:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	◎
JIS C 5402-12-6:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 5402-1-3:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	-	×
JIS C 5402-13-2:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	◎	-
JIS C 5402-1-4:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	-	×
JIS C 5402-14-7:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	◎
JIS C 5402-15-8:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	-	×
JIS C 5402-16-2:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	◎	-
JIS C 5402-16-20:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	-	-
JIS C 5402-16-4:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	◎	×
JIS C 5402-16-5:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	◎	-
JIS C 5402-16-7:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	◎	-
JIS C 5402-17-3:2018	制定	2018/2/20	経産	電子技術	◎	◎	-
JIS C 5402-19-3:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	×
JIS C 5630-26:2017	制定	2017/10/20	経産	電子技術	◎	-	-
JIS C 5860:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	-	×	-

参照文書の記号の説明:
◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、存
続している。
× 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、改
正及び/又は廃止されている(現状が不明なものも含む)。

対応国際規格	対応国際規格の 同等性	制定年月日	最新改正日
IEC 60384-20:2015	IDT	2000/04/20	2018/02/20
IEC 60384-23:2015	IDT	2008/05/20	2018/02/20
IEC 60384-23-1:2006	IDT	2008/05/20	
IEC 60384-24:2015	IDT	2009/12/21	2018/02/20
IEC 60384-25:2015	IDT	2009/12/21	2018/02/20
IEC 60384-26-1:2010	IDT	2012/06/20	
IEC 60384-8:2015	IDT	1998/07/20	2018/02/20
IEC 60384-9:2015	IDT	1998/07/20	2018/02/20
IEC 62391-1:2015	IDT	2009/07/20	2018/02/20
IEC 61643-22:2015	IDT	2007/01/20	2018/02/20
IEC 60512-1:2001	IDT	2002/03/20	
IEC 60512-11-1:1995	IDT	2002/03/20	
IEC 60512-11-8:1995	IDT	2002/03/20	
IEC 60512-12-6:1996	IDT	2002/03/20	
IEC 60512-1-3:1997	IDT	2002/03/20	
IEC 60512-13-2:2006	IDT	2012/06/20	
IEC 60512-1-4:1997	IDT	2002/03/20	
IEC 60512-14-7:1997	IDT	2002/03/20	
IEC 60512-15-8:1995	IDT	2002/03/20	
IEC 60512-16-2:2008	IDT	2012/06/20	
IEC 60512-16-20:1996	IDT	2002/03/20	
IEC 60512-16-4:2008	IDT	2012/06/20	
IEC 60512-16-5:2008	IDT	2012/06/20	
IEC 60512-16-7:2008	IDT	2012/06/20	
IEC 60512-17-3:2010	IDT	2018/02/20	
IEC 60512-19-3:1997	IDT	2002/03/20	
IEC 62047-26:2016	IDT	2017/10/20	
		1990/01/01	2012/11/20

2022年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、廃止又は “未入力”)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	案作成団体
C5914	光サーキュレータ通則	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5916	光伝送用分散補償器通則	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5954-3	光伝送用能動部品—試験及び測定方法—第3部:直心直伝送リンク用光送・受信モジュール	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提案)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5962	光ファイバコネクタ通則	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	5: 無(提案)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5964-4-100	光ファイバコネクタかん合標準—第4-1-100部:SC形光ファイバコネクタ類—SC—PC簡易シレフタクル(F16形)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5964-5	光ファイバコネクタかん合標準—第5部:MTコネクタ類(F12形)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5964-6-100	光ファイバコネクタかん合標準—第6-100部:MU形光ファイバコネクタ類—MU—PC簡易シレフタクル(F17形)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5965-3-31	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—光ファイバコネクタ光学互換標準—第3-31部:シングルモード光ファイバ用1列多心角形ポリフェニレンスルフィド(PPS)8度斜めPC端面フェルールの接線部パラメータ	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5981	F12形多心光ファイバコネクタ(MTコネクタ)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	6: 無(提案)対応国際規格が存在せず、今後の対応未定のもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
C60063	抵抗器及びコンデンサの標準数列	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C60068-2-77	環境試験方法—電気・電子—表面実装部品(SMD)の本体強度及び衝撃耐性試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C60068-3-13	環境試験方法—電気・電子—第3-13部:支線支線及び指針—はんた付け	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C6122-10-4	光増幅器—測定方法—第10-4部:マルチチャネルパラメータ—光スペクトラムアナライザを用いた補間法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C6122-4-3	光増幅器—測定方法—第4-3部:過渡パラメータ—パワー制御単一チャネル光増幅器のパワーパラメータ測定	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-1	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-1部:正弦波振動試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-15	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-15部:結合部ねじり試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-21	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-21部:混合温度サイクル試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-26	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-26部:塩水噴霧試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-5	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-5部:光ファイバクラック強度試験(ねじり)	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-9	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-9部:衝撃試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-11	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-11部:結合力及び離脱力測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-24	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-24部:偏波面保存光ファイバ付き光ファイバコネクタのキー位置精度測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-27	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-27部:多心光ファイバコネクタの位置精度測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-32	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-32部:光受動部品の偏波モード分散測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-34	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-34部:ランダム接続時の挿入損失	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-36	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-36部:光ファイバコネクタフェルールの内径及び外径の測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-43	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-43部:光ファイバ光波のモードトランスファクション測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-7	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-7部:シングルモード光部品の光損失及び反射減衰量の波長依存性測定	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び 西暦年	最新 公示		主務大臣	専門委員会	参照文書 (JSA調査結果)		
	種類	年月日			対応国際規格	引用JIS	引用国際規格
JIS C 5914:2013	確認	2017/10/20	経産	電子技術	×	×	-
JIS C 5916:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	×	×	-
JIS C 5954-3:2013	確認	2017/10/20	経産	電子技術	-	×	×
JIS C 5962:2018	改正	2018/2/20	経産	電子技術	×	×	×
JIS C 5964-4-100:2018	制定	2018/3/20	経産	電子技術	◎	◎	-
JIS C 5964-5:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 5964-6-100:2018	制定	2018/3/20	経産	電子技術	◎	◎	-
JIS C 5965-3-31:2018	制定	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	×
JIS C 5981:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	-	×	-
JIS C 60063:2018	制定	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 60068-2-77:2002	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 60068-3-13:2016	制定	2018/2/20	経産	電子技術	◎	×	×
JIS C 6122-10-4:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	-
JIS C 6122-4-3:2018	制定	2018/2/20	経産	電子技術	×	×	-
JIS C 61300-2-1:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	◎
JIS C 61300-2-15:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	◎
JIS C 61300-2-21:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	◎
JIS C 61300-2-26:2013	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	◎
JIS C 61300-2-5:2013	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	×
JIS C 61300-2-9:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	×	×	◎
JIS C 61300-3-11:2013	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	-	-
JIS C 61300-3-24:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	×	-	-
JIS C 61300-3-27:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	-	-
JIS C 61300-3-32:2013	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	◎	×
JIS C 61300-3-34:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	◎
JIS C 61300-3-36:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	-	-
JIS C 61300-3-43:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	-	-
JIS C 61300-3-7:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	◎	×	×

参照文書の記号の説明:
 ◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、継続している。
 × 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、改正及び/又は廃止されている(現状が不明なものも含む)。

対応国際規格	対応国際規格の 同等性	制定年月日	最新改正日
IEC 62077:2010	MOD	2006/03/25	2013/03/21
IEC 61978-1:2009	MOD	2006/03/25	2012/05/21
		2013/03/21	
IEC 60874-1:2011/IEC 61274-1:2011	MOD/MOD	1987/06/01	2018/02/20
IEC 61754-4-100:2015	IDT	2018/03/20	
IEC 61754-5:2005	MOD	2012/05/21	
IEC 61754-6-100:2015	IDT	2018/03/20	
IEC 61755-3-31:2015	IDT	2018/02/20	
		1993/10/01	2012/05/21
IEC 60063:2015	IDT	2018/02/20	
IEC 60068-2-77:1999	IDT	2002/03/20	
IEC 60068-3-13:2016	IDT	2018/02/20	
IEC 61290-10-4:2007	IDT	2012/11/20	
IEC 61290-4-3:2015	IDT	2018/02/20	
IEC 61300-2-1:2009	MOD	2012/11/20	
IEC 61300-2-15:2008	IDT	2012/05/21	
IEC 61300-2-21:2009	MOD	2012/11/20	
IEC 61300-2-26:2006	MOD	2013/03/21	
IEC 61300-2-5:2009	IDT	2013/03/21	
IEC 61300-2-9:2010	MOD	2012/11/20	
IEC 61300-3-11:1995	IDT	2013/03/21	
IEC 61300-3-24:2006	IDT	2012/11/20	
IEC 61300-3-27:1997	IDT	2012/05/21	
IEC 61300-3-32:2006	MOD	2013/03/21	
IEC 61300-3-34:2009	IDT	2012/11/20	
IEC 61300-3-36:2000	IDT	2012/05/21	
IEC 61300-3-43:2009	IDT	2012/11/20	
IEC 61300-3-7:2009	MOD	2012/11/20	

2022年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、廃止又は “未入力”)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
C6183-2	光スペクトラムアナライザ—第2部:校正方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C6704	人工水晶	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		日本水晶デバイス工業会
C6803	レーザー製品の安全—光ファイバ通信システムの安全	改正	改正に着手しており、本年度中に改正公示予定であるため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C6820	光ファイバ通則	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定であるため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C6835	石英系シングルモード光ファイバ素線	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C6839	屋内用テーパー形ファイバコード	廃止	廃止に着手しており、本年度中に廃止公示予定であるため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C6842	光ファイバ偏波モード分散試験方法	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C6864	マルチモード光ファイバモード遅延時間差試験方法	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定であるため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び 西暦年	最新 公示		主務 大臣	専門 委員会	参照文書 (JSA調査結果)	
	種類	年月日			対応 国際 規格	引用 国際 規格
JIS C 6183-2:2018	制定	2018/3/20	経産	電子技術	◎	× ×
JIS C 6704:2017	改正	2017/10/20	経産	電子技術	◎	× -
JIS C 6803	改正	2017/10/20	経産	電子技術	×	× -
JIS C 6820:2018	改正	2018/2/20	経産	電子技術	×	- -
JIS C 6835:2017	改正	2017/10/20	経産	電子技術	×	× ◎
JIS C 6839:2008	確認	2017/10/20	経産	電子技術	×	× ×
JIS C 6842:2012	確認	2017/10/20	経産	電子技術	×	× ×
JIS C 6864:2008	確認	2017/10/20	経産	電子技術	×	× -

参照文書の記号の説明：
 ◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、継続している。
 × 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、改正及び/又は廃止されている（現状が不明なものも含む）。

対応国際規格	対応国際規格の 同等性	制定年月日	最新改正日
IEC 62129-1:2016	IDT	2018/03/20	
IEC 60758:2016	MOD	1975/03/01	2017/10/20
IEC 60825-2:2010	IDT	2006/01/20	2017/10/20
IEC 60793-1-1:2017;IEC 60793-2:2015	MOD/MOD	1987/06/01	2018/02/20
IEC 60793-2-50:2015	MOD	1989/03/01	2017/10/20
IEC 60794-2-30:2003	MOD	1993/10/01	2008/01/20
IEC 60793-1-1:2008;IEC 60793-1-49:2007	MOD/MOD	2012/05/21	
IEC 60793-1-49:2003	IDT	2008/01/20	